



中華民國專利證書

發明第 I 822562 號

發明名稱：自閉症光譜量表的問題篩選方法及篩檢患有自閉症的兒童的方法和系統

專利權人：國立臺灣大學

發明人：高淑芬、鄭中遠

專利權期間：自 2023 年 11 月 11 日至 2043 年 1 月 16 日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局局長

廖承威

中華民國 112 年 11 月 11 日

